

FTGEN - система генерирования функциональных тестов

Ubar, Raimund-Johannes; Dušina, Julia; Zaugarov, Viktor; Крупнова Е.; **Storožev, Sergei** Proceedings of CAD-93 : new information technologies for science, education and business, Yalta, May 4-13, 1993 1993 / p. 123-125

Functional test program generation for digital systems

Ubar, Raimund-Johannes; Dušina, Julia; Krupnova, Helena; Storožev, Sergei; Zaugarov, Viktor Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen : proceedings of the 6th workshop, Vaals (Niederlande), March 6-8, 1994 1994 / p. 14-18: ill

State assignment for CMOS implementation of low power FSM networks

Zaugarov, Viktor; Kasirova, Lilia; Tveretina, Olga Mixed Design of Integrated Circuits and Systems : education of computer aided design of modern ICs and devices : 3rd Advanced Training Course, Lodz, Poland, 30 May - 1 June 1996 1996 / p. 195-198: ill

Symbolic test generation for hierarchically modeled digital systems

Zaugarov, Viktor 1993 https://www.ester.ee/record=b2090336*est

Декомпозиционный метод представления объектов диагностирования моделями обобщенных альтернативных графов

Zaugarov, Viktor Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 98-102: ill

Система генерирования тестов для микропроцессоров

Ubar, Raimund-Johannes; Dušina, Julia; Zaugarov, Viktor; Крупнова Е.; **Storožev, Sergei** Proceedings of international conference "Technical Diagnostics-93", St.-Peterburg, June 8-10, 1993 1993 / p. 87-89

Система синтеза тестовых программ для дискретных объектов диагностирования (ОД)

Zaugarov, Viktor; Saarepera, Maimu; Storožev, Sergei Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 78-89: ill